

第 8 回日本非破壊検査工業会技術討論会

討論テーマ「非破壊検査の歩みと今後」

《プログラム》

主催 一般社団法人日本非破壊検査工業会

協賛 一般社団法人日本非破壊検査協会

開催日時 平成 24 年 7 月 12 日(木) 10 時 00 分～17 時 00 分

会場 東京都品川区立総合区民会館(きゅりあん)1 階 小ホール
(東京都品川区東大井 5-18-1)

<開会宣言> 10:00～10:05 技術討論会実行委員会委員長 前川真一

<理事長挨拶> 10:05～10:10 日本非破壊検査工業会理事長 松村康人

<特別講演 1> 10:10～12:10 座長 岡 賢治(株)検査技術研究所)

10:10～11:10

「壊さずに確かめる、その源流と軌跡」

サイテック アソシエーツ

柳 千秋

<特別講演 2>

11:10～12:10

「超音波探傷の歩みと今後」

元日本非破壊検査協会副会長

松山 宏

<昼休み>

12:10 ～ 13:10

<一般討論> 13:10～14:20

座長 関根 昇(東京理学検査(株))

13:10～13:45

「非接触空中超音波検査法の開発と最近の応用例」

ジャパンプローブ株式会社

高橋 雅和

13:45～14:20

「AE 適用分野と今後の展望」

株式会社 IHI検査計測

中村 英之

<休憩>

14:20 ～ 14:35

<一般討論> 14:35～15:45

座長 砂川 浩一(総合非破壊検査(株))

14:35～15:10

「後方散乱 X 線による非破壊検査」

ポニー工業株式会社

金久保 和雅

15:10～15:45

「鋼構造溶接部への渦流探傷による表面探傷試験」

GEセンシング&インペクション・テクノロジーズ株式会社

川合 泰弘

<休憩>

15:45 ～ 16:00

<パネルディスカッション> 16:00～16:45

司会進行 松本 章(株)ジャスコ)

テーマ「非破壊検査の可能性と広がるフィールド」

パネリスト: ジャパンプローブ(株) 高橋 雅和、IHI検査計測 中村 英之、ポニー工業(株) 金久保 和雅

GEセンシング&インペクション・テクノロジーズ(株) 川合 泰弘、(株)アミック 長岡 康之、

(株)ダンテック 前川真一、日本非破壊検査(株) 俣賀 文雄

<閉会宣言>

16:45～16:50

技術部会長 長岡 康之